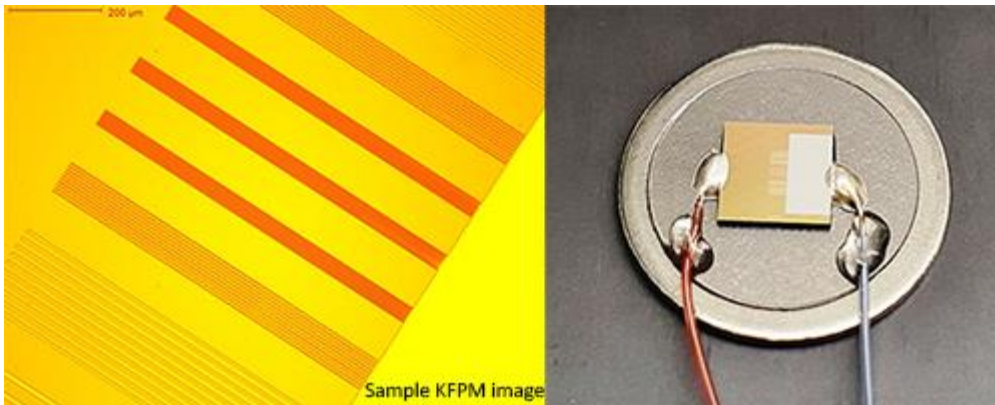


KPFM および EFM テスト サンプル

金とアルミニウムの線を交互に隙間なく配置

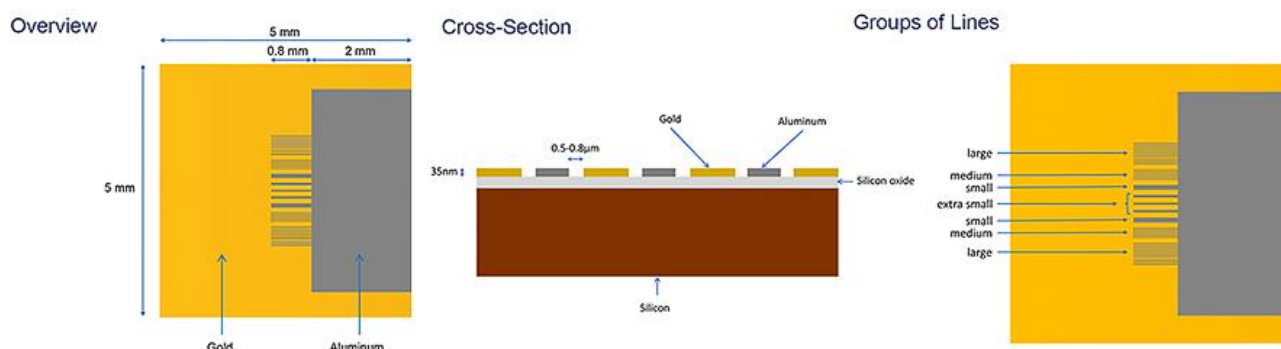


イントロダクション

KPFM および EFM テスト サンプルは、ケルビン プローブ フォース 顕微鏡および静電力顕微鏡の性能をテストするために特別に設計されています。この実用的なテストサンプルは、シリコン基板で覆われた酸化シリコン上にアルミニウムと金の線が交互に堆積された配列で構成されています。ライン配列ピッチは4、8、20、40 μm の4種類で、ライン間のギャップは0.5~0.8 μm です。ライン高さは約35nm です。

KPFM および EFM テスト サンプルの特徴

- Al と Au の線が交互に並んだ配列
- ライン配列ピッチは 4、8、20、40 μm 、ギャップは 0.5 ~ 08 μm 。
- ラインの高さは約 35nm
- スタックは、 $\varnothing 12\text{mm}$ のガラスディスクと $\varnothing 15\text{mm}$ の金属ディスク上にシリコンチップを載せたもので、全体の高さは 1.5mm です。
- Al と Au のパッドに接続された細い銅線



KPFM および EFM テストサンプルの仕様

パーツ番号	34-033040			
ライン高さ	35 nm			
ギャップ幅	0.5 – 0.8 um			
ライン幅	グループ	ピッチ	Al	Au
	最大	40 um	10 ± 0.5 um	29 ± 0.5 um
	中	20 um	5 ± 0.5 um	14 ± 0.5 um
	小	10 um	2 ± 0.5 um	6 ± 0.5 um
	最小	4 um	1 ± 0.5 um	2 ± 0.5 um

KPFM および EFM テストサンプル



KPFM および EFM 試験サンプル
Al および Au ライン配列付き
15mm 金属 AFM ディスクにマウント

パーツ番号	数量	価格
34-034040	1 個	¥191,400

備考：本内容は予告なしに変更されることがございます。



エルミネット株式会社

〒124-0012 東京都葛飾区立石 3-15-4

TEL:03-6379-4105 FAX:03-6379-4106

www.elminet.co.jp

CT20 KPFM & EFM test 2507A3